

Anmeldung für eine Tagungsteilnahme

Bitte bis zum 18.11.2011 faxen an
(030) 63 92-65 01



Name _____

Vorname _____ Titel _____

Firma/Einrichtung _____

Adresse _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____

Spätmeldung Poster ja nein

Titel des Posters (eine Kurzfassung des Beitrages mit Angabe der
Co-Autoren und der zugehörigen Firmen / Einrichtungen bitte beifügen)

Teilnahmegebühren

170,00 €, Studenten 20,00 €

Überweisung an: IAP e. V.

Konto-Nr. 102 000 5920, Deutsche Kreditbank AG Berlin, BLZ 120 300 00

Anmeldung von Ausstellungsfläche

4 m² 6 m² 8 m²

Miete 125,00 €/m²

Ein Vertreter des Ausstellers nimmt gebührenfrei an der Tagung teil.

Hotelreservierung

zu Vorzugspreisen von 63,00 € für ein EZ bzw. 74,00 € für ein DZ
plus 12,00 € Frühstück

EZ DZ vom _____ bis _____

Ort, Datum

Unterschrift

Veranstalter

IAP Institut für angewandte
Photonik e.V., Berlin
IfG – Institute for Scientific
Instruments GmbH, Berlin
Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin
Bruker Nano GmbH, Berlin
Fraunhofer Institut für Elektronische
Nanosysteme (ENAS), Chemnitz
Optec Berlin-Brandenburg e.V.
Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt, Braunschweig und Berlin
SPECTRO Analytical Instruments
GmbH, Kleve
Technische Universität Berlin
TSB – Technologiestiftung, Berlin
VDI/VDE – Gesellschaft Mess-
und Automatisierungstechnik (GMA)
VDI-Bezirksgruppe Adlershof
WISTA-MANAGEMENT GMBH

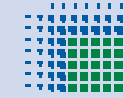
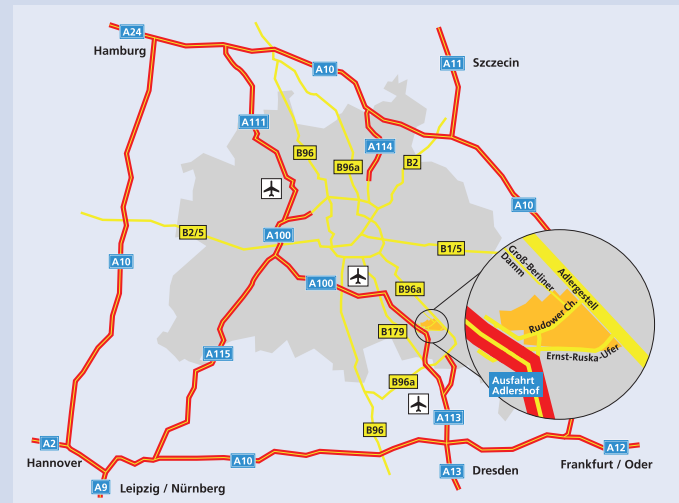
Organisation und Korrespondenzanschrift

Dipl.-Ök. A. Weiß (Organisation)
Tel.: (030) 63 92-65 09
Frau D. Zimani (Sekretariat IAP e. V.
und IfG GmbH)
Tel.: (030) 63 92-65 00
IAP Institut für angewandte
Photonik e.V.
Rudower Chaussee 29/31, 12489 Berlin
Fax: (030) 63 92-6501
E-Mail: info@ifg-adlershof.de

Programmkomitee

E. Auerswald, ENAS, Chemnitz
B. Beckhoff, PTB, Berlin
A. Bjeoumikhov, IfG GmbH, Berlin
F. Burgäzy, Bruker AXS GmbH, Karlsruhe
W. Daum, BAM, Berlin
J. Flock, ThyssenKrupp Stahl AG,
Duisburg
A. Janßen, FH Münster
B. Kanngießner, TU Berlin
M. Krumrey, PTB, Berlin
N. Langhoff, IfG GmbH, Berlin
A. Kharchenko, PANalytical,
Almelo, Niederlande
M. Maiwald, BAM, Berlin
H. Miersch, Spectro Analytical
Instruments GmbH, Kleve
M. Ostermann, BAM
U. Panne, BAM und
Humboldt-Universität, Berlin
P. U. Pennartz, Rigaku Innovative
Technologies
W. Sandner, Max-Born-Institut Berlin
Th. Schüle, Bruker Nano GmbH, Berlin
R. Wedell, IAP, Berlin
J. Wiesmann, Incoatec GmbH,
Geesthacht

Anfahrtsskizzen auch unter
www.adlershof.de



PRORA 2011

Fachtagung Prozessnahe Röntgenanalytik

24. und 25. November 2011

im WISTA – Wissenschafts-
und Technologiepark Adlershof
Einstein-/Newton-Kabinett
Bunsensaal
Rudower Chaussee 17
12489 Berlin



PROGRAMM

DONNERSTAG, 24.11.2011

- 10.00 – 10.20 Eröffnung
H. Schmitz (WISTA MANAGEMENT GMBH)
B. Weidner (OptecBB)
R. Wedell (IAP e.V.)
- 10.20 – 12.30 **Methodische Probleme der Prozessanalytik**
Leitung: R. Wedell
- 10.20 – 10.50 *U. Panne (HU Berlin und BAM) (E)*
Hyphenated Spectroscopy – Prospects for XRF?
- 10.50 – 11.10 *J. Piltz (amtec Analysenmesstechnik GmbH)*
Die Verfügbarkeit von Inline-Messsystemen
- 11.10 – 11.30 *J. Simon (Thermo Fisher Scientific GmbH)*
Vielfältige Möglichkeiten der Mikroanalytik am SEM und der Oberflächenanalytik mittels XPS
- 11.30 – 11.50 *V. Rößiger (Helmut Fischer GmbH)*
Referenznormale für die RFA
- 11.50 – 12.10 *F. Eggert (EDAX / Ametek)*
Spektrenauswertung unter Berücksichtigung des Pile-Up Effektes bei SDD Spektrometern und hohen Impulsraten
- 12.10 – 12.30 *M. Haschke u.a. (Bruker Nano GmbH)*
Energieauflösung vs. Zählraten – was ist der optimale Kompromiss?
- 12.30 – 13.30 Mittagspause
- 13.30 – 15.00 **Applikationen in der Industrie**
Leitung: B. Beckhoff
- 13.30 – 14.00 *Ch. Zarkadas (PANalytical B. V.) (E)*
X-Ray Fluorescence Analysis for Industrial Applications
- 14.00 – 14.20 *D. Mucke u.a. (GEOMONTAN Gesellschaft für Geologie und Bergbau mbH & Co. KG)*
Erfahrungen mit SPECTRO xSORT bei der modernen Erkundung einer Kupferlagerstätte im Zechstein
- 14.20 – 14.40 *N. Kessler (Thermo Fisher Scientific GmbH)*
Neue Möglichkeiten in der Röntgenanalytik durch Mapping und Spotting mit dem Thermo ARL Perform X
- 14.40 – 15.00 *S. van den Bosch (ThyssenKrupp Steel Europe AG)*
Kombination der XRF mit anderen Analyseverfahren
- 15.00 – 15.30 Kaffeepause
- 15.30 – 17.40 **Neue Entwicklungen bei Komponenten für röntgenanalytische Geräte**
Leitung: Th. Schülein

- 15.30 – 15.50 *A. Erko et al. (HZB für Materialien und Energie / BESSY)*
Novel Wavelength-Dispersive Parallel X-Ray Spectrometer
- 15.50 – 16.10 *S. Bjeoumikhova u.a. (IfG GmbH)*
Röntgenkapillarroptiken für verschiedene analytische Anwendungen – erreichter Entwicklungsstand
- 16.10 – 16.40 *L. Vincze et al. (University of Ghent, Belgium) (E)*
Applications of Full Field Micro-XRF Analysis using a Prototype X-Ray Colour Camera
- 16.40 – 17.00 *A. Kühn u.a. (BAM, IAP e.V., PNSensor, HU Berlin)*
Schnelle orts aufgelöste Messung der Elementverteilung in TXRF – Proben
- 17.00 – 17.20 *J. Wiesmann et al. (Incoatex GmbH)*
High Brilliance Microfocus Sources for X-Ray Diffractometry
- 17.20 – 17.40 *M. Krämer et al. (AXO Dresden GmbH)*
XRF Reference Samples for Applications in Synchrotron and Laboratory Instrumentation
- 18.00 – 19.30 **Postersession und Rundgang**
durch die Firmenausstellung
Eröffnung: E. Auerswald
- 19.30 Gemeinsames Abendessen

FREITAG, 25.11.2011

- 9.00 – 10.30 **Applikationen in der Industrie**
Leitung: H. Miersch
- 9.00 – 9.30 *A. Nutsch (Fraunhofer Institut IISB) (E)*
Röntgenanalytik zur Charakterisierung von Oberflächenkontaminationen und dünnen Filmen auf Halbleitersubstraten
- 9.30 – 09.50 *T. Trobitzsch-Ryll u.a. (IfG GmbH)*
Prozessnahe Röntgenanalytik an Dünnschichtsystemen mit IfG Messköpfen ELBRUS
- 9.50 – 10.10 *H. Borrmann u.a. (MPI für Chemische Physik fester Stoffe)*
Harte Röntgenstrahlung in der (Pulver-)Diffraktometrie
- 10.10 – 10.30 *T. Salge et al. (Bruker Nano GmbH, BAM, Anadolu University / Türkei)*
Advanced Light Element and Low Energy X-Ray Analysis of Ceramics and Ceramic-Metal Joints using SEM/EDX with Silicon Drift Detectors (SDD)
- 10.30 – 11.00 Kaffeepause
- 11.00 – 12.30 *Leitung: M. Ostermann*
- 11.00 – 11.30 *A. Braun (Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology) (E)*
Application of X-Ray and Electron Spectroscopy to Energy Materials

- 11.30 – 11.50 *M. Müller u.a. (PTB)*
Röntgenspektrometrie für die Entwicklung neuer Materialien für die Energieerzeugung und Speicherung
- 11.50 – 12.10 *A. Zierau u.a. (L.U.M. GmbH und IAP e. V.)*
Untersuchung zur Volumenkonzentrationsauflösung ausgewählter Suspensionen mittels monoenergetischer Röntgentransmission
- 12.10 – 12.30 *H. Miersch u.a. (Spectro Analytical Instruments GmbH)*
Der Weg des Lichts & der Weg der Daten
- 12.30 – 13.30 Mittagspause
- 13.30 – 15.40 **Neue röntgenanalytische Methoden**
(Forschungsvorlauf)
Leitung: N. Langhoff
- 13.30 – 14.00 *I. Mantouvalou u.a. (TU Berlin / BLiX, Max-Born-Institut) (E)*
Laserplasmaquellen für angewandte Röntgenspektroskopie im Spektralbereich weicher Röntgenstrahlung
- 14.00 – 14.20 *R. Unterumsberger u.a. (PTB)*
Vergleich von quantitativer Röntgenfluoreszenzanalyse an vergrabenen Nanoschichten in konventioneller Geometrie und unter streifendem Einfall
- 14.20 – 14.40 *B. Pollakowski u.a. (PTB)*
Zerstörungsfreie chemische Speziation von tief vergrabenen Nanostrukturen mithilfe von GIXRF-NEXAFS
- 14.40 – 15.00 *E. Zschech (Fraunhofer IZFP Dresden)*
Anwendung der Röntgenmikroskopie zur Prozessentwicklung bei der 3D IC-Integration
- 15.00 – 15.20 *J. Wernecke u.a. (PTB)*
Charakterisierung von Nanostrukturen auf Oberflächen mittels Röntgenkleinwinkelstreuung unter streifendem Einfall (GISAXS)
- 15.20 – 15.40 Schlusswort

Im Vorfeld der Fachtagung PRORA findet zum zweiten Mal das Satellite-Meeting des „Berlin Laboratory for innovative X-Ray Technologies“, BLiX, an der TU Berlin statt. In dieser Veranstaltung werden laufende Arbeiten des BLiX und der Arbeitsgruppe „Analytische Röntgenphysik“ vorgestellt.

Ort: TU Berlin, Hardenbergstr. 26, Raum EW 049/050
Zeit: Mittwoch, 23.11.2011, 14.00 – 16.00 Uhr

Anmeldungen für das Satellite-Meeting können mit der Anmeldung zur PRORA erfolgen.